

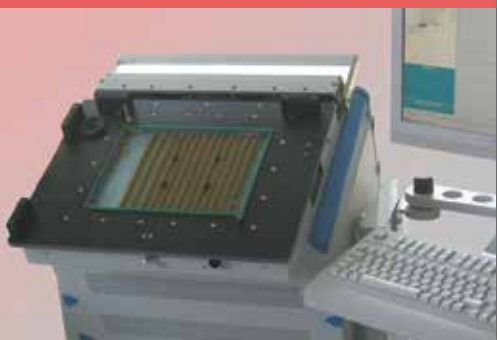
CT300, CT350

MDA, ICT, FKT

ELEKTRISCHER TEST

MDA, ICT, FKT, INSPEKTION

- SKALIERBARE MODULTECHNIK (MDA, ICT, FKT, BSCAN)
- VIELFÄLTIGER SYSTEMAUFBAU (19", TISCH, RACK, INLINE)
- UMFANGREICHE FUNKTIONSTEST-LÖSUNGEN
- UMFANGREICHE CAD-IMPORTE, PAPIERLOSE REPARATURSTATION, STATISTIK FUNKTIONEN UND DATENBANKANBINDUNG INKLUSIVE
- IN DER TESTER-SOFTWARE INTEGRIERTER aOI UND LED-TEST
- MADE IN GERMANY



ATECARE
automatic test equipment
sales & support

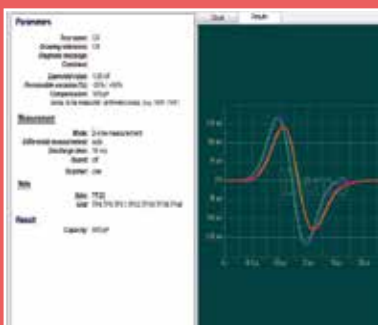


ANALOG-TEST

MDA: MANUFACTURING DEFECT ANALYZER

Das System ist sehr einfach zu handhaben.

Die CT300-Serie ist in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. In allen Varianten kommt dabei die komplett identische Plattform zum Einsatz.



Scope-Funktion

INTEGRIERTE VERFAHREN

- Oszilloskope
- DVM (Digital-Volt-Meter)
- AWG (Arbitrary Waveform Generator)

POLARITÄTSTEST BEI KONDENSATOREN

- Leckstrom-Messung
- Pin Scan[®] Erkennung

aOI-TEST

- Anzeigenerkennung
- Polung
- Vermessungen

STROMVERSORGUNG

- Umfangreich On-Board
- interne und externe Erweiterungen
- automatische Entladeroutinen

RCL-PRÜFUNG

- ATG automatischer Testgenerator
- 4-Draht Messung
- Guarding

PRÜFUNG VON TRANSISTOREN/DIODEN

- Dioden
- Zener-Dioden
- Transistoren: PNP, NPN
- FETs/Thyristoren (SCR)/TRIACs
- Opto-Koppler

LED-INSPEKTION

- Glasfaser Kontakt
- Verstärker im POGO Kontaktblock
- sehr schnelle und präzise Inspektion

PIN SCAN[®] TECHNOLOGIE

- Erkennt Unterbrechungen bei SMT Bauteilen, z.B. an ICs oder Steckern



Analog-Modul



PIN-Scan[®]-Modul



CT300 Meteor



CT300 Satellite

DIGITAL-TEST

ICT: IN-CIRCUIT-TEST

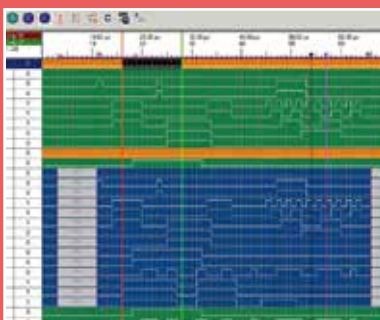
Durch die enge Zusammenarbeit und Beratung zwischen Entwicklern und Anwendern wird das Testsystem entsprechend den Bedürfnissen der Kunden konfiguriert und angepasst.



CAD-Daten Aufbereitung



Digital-Modul



Digitalsignal-Editor

DIGITALTEST

- Schneller Digitaltest bis 300 MS/s
- Hochvolt-Digitalmodul bis 35 V

LEISTUNGSFÄHIGER BOUNDARY SCAN TEST

- Der Boundary Scan Test nach IEEE1149.6
- Integriert in der Tester-Software
- optionale Integration anderer Hersteller

EINFACH ZU BEDIENENDE ONBOARD PROGRAMMSOFTWARE

Modularisierte Speicher-Algorithmen ermöglichen eine einfache On-Board Programmierung:

- OBP-Karten für die parallele Programmierung unterschiedlicher Inhalte
- Flash Programmierung
- Serielle Programmierung
- EE-PROM Programmierung

EINFACHE BEDIENUNG

Die Bedienung ist flexibel und leicht verständlich:

- Grafischer Programm-Editor
- eigene Skripte möglich
- Kurvenformen editierbar

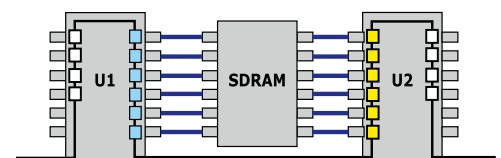
OPTIONALE STROMVERSORGUNGEN

- Festspannungsquellen
- programmierbare AC und DC Quellen

WIRTSCHAFTLICHE TESTSTRATEGIE

- Pin-Architektur ist nicht gemultipliziert.
- automatisierte Pin-Verteilung
- leichte Anpassung bei Änderungen
- Softwaregeführtes Debug-Verfahren
- Integrierte Selbsttest Diagnose

Auch nicht-Boundary-Scan fähige Bauelemente können verkettet werden



FUNKTIONS-TEST

FKT: LEICHTE INTEGRATION EXTERNER MODULE IN BESTEHENDE SOFTWARE-STRUKTUREN

Das Grundsystem besteht aus einem variablen Gehäuseaufbau. Je nach Kundenwunsch und -bedarf lassen sich einfache Tischaufbauten, Integrationen in 19" Racks, pneumatische Press-down-Units, vakuumbasierende Tischaufbauten bzw. In-Line Kombinationen erstellen.

Die Software ist intuitiv grafisch bedienbar und bedarf keiner Ausbildung für Hochsprachen. Als Komplettpaket gibt es die Software zur Bearbeitung von CAD-Daten, den automatischen Testprogramm-Generator (ATG) und die Bediener- und Reparatur-Software.

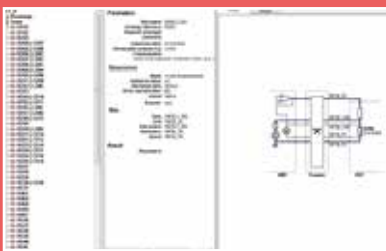
Die dazu gehörige Adaption kann daher ebenso vielfältig gestaltet sein (z.B. Handhebeladapter, Press-Down Konzepte, Nadelbettadapter mit Vakuumanschluss, Wechselsatzadapter, etc.). Dies bestimmt in aller Regel der maximale Pinausbau oder der spezielle Kundenwunsch.



Inline Testhandler mit CT300



Reparaturstation



Programmierung



Erweiterung zum FKT

IN-CIRCUIT- UND FUNKTIONSTEST IN EINEM SYSTEM

Integration von vielfältigen, selbst erstellten oder am Markt verfügbaren Modulen, z.B.:

- RS 232
- GPIB
- PXI
- USB
- Anbindung von anderen Bus-Strukturen (z.B. CAN-Bus, MOST-Bus, etc.)
- 2-Stufen-Adaptierung: Vakuum, pneumatisch, mechanisch und elektrisch
- Integration vorhandener Adaptionlösungen
- In-Line Lösungen verfügbar
- Anbindung an DB und Traceability

OPTIONEN

- Testadapter
- Konvertierung bestehender Adaptionlösungen ist möglich
- Programmierdienstleistung

CT350 Comet



LEICHTER AUS- UND UMBAU MIT BEREITS BESTEHENDEN MODULEN

AUSBAU

MDA → ICT → FKT

Eine MDA Grundversion enthält alle notwendigen Hard- und Software-Module. Die Aufrüstung zu einem vollwertigen ICT-Testsystem erfolgt über eine Hardware-Erweiterung. Für den Vollausbau zum Kombitester kann das MDA/ICT der Master sein oder der FKT ist der Master des MDA/ICT.

UMBAU

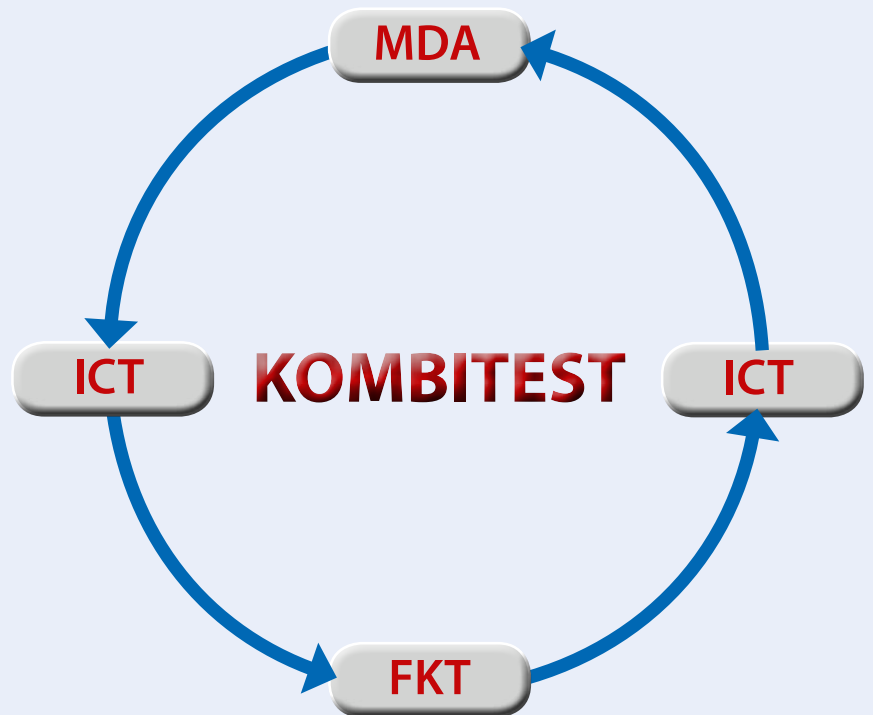
FKT → ICT → MDA

Das System ermöglicht frei skalierbare Hardware-Zusammenstellungen - die Software ist schon dabei.

Es ist mit aOI Funktionen erweiterbar (Displays, LED, Vermessung etc.).

ERWEITERUNGEN

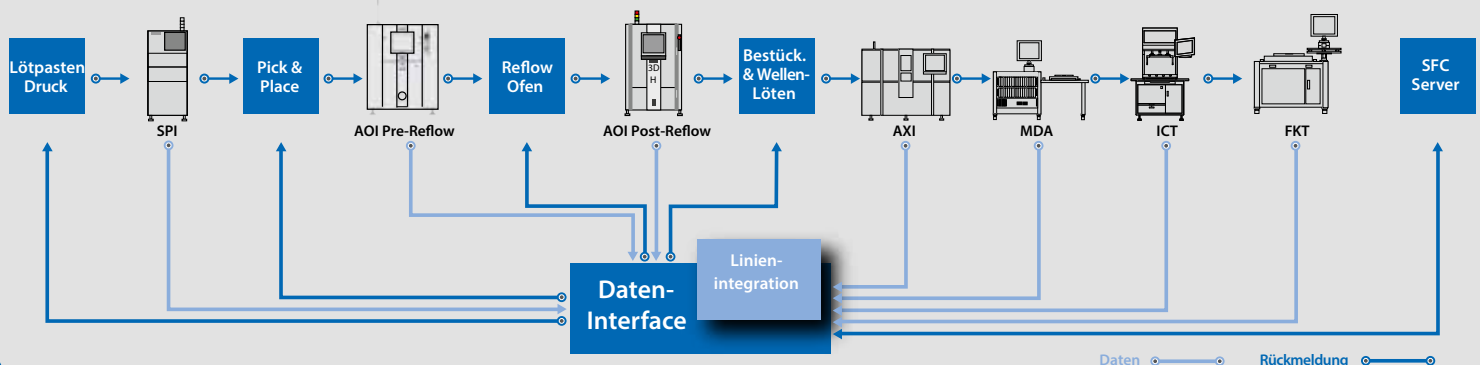
Selbstverständlich ist das System auch mit Boundary-Scan Lösungen, vektorlosen Testverfahren, LED-Testverfahren, externen Geräteerweiterungen sowie Schnittstellen zu MES/ Traceability Systemen vorbereitet und jederzeit erweiterbar.



MDA: Manufacturing Defect Analyzer
ICT: In-Circuit Test
FKT: Funktions-Test

LINIENINTEGRATION

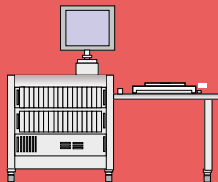
ANBINDUNG AN HANDLING-SYSTEME, AOI-REPARATURPLÄTZE, INTEGRATION IN MES- UND TRACEABILITY-WERKZEUGE



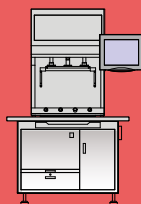
SKALIERBARE TEILLÖSUNGEN



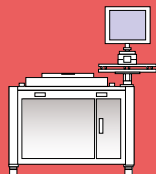
DESKTOP



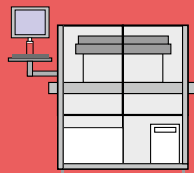
TISCH & RACK



PRESS DOWN



VAKUUM



IN-LINE

ATECARE
automatic test equipment
sales & support

ALLGEMEIN

Bis zu 5.472 analoge Testpunkte, in Schritten von 144/72 Pins pro Modul
Betriebssystem: Microsoft® Windows 7®, Windows 10®
Stromversorgung: 230 V, automatische Umschaltung, 50/60 Hz
Test-Adapter: manuell, elektrisch oder Vakuum (optional)

MESSEINRICHTUNGEN, ANALOG

Test-Schaltmatrix: 4/8-Draht-Matrix
Frequenzen: 0,3 Hz, bis 20 MHz
Spannungsquelle: -36 V bis ± 40 V, Auflösung: 10 mV
Stromquelle: 0 bis 500 mA, Auflösung: 0,1 mA
DC-Hochspannungsquelle: 0 bis 52 V (integriert)
Waveform-Generator: ± 9 V, 30 MS/s @ 16 bit Auflösung oder $\pm 2,5$ V, 125 MS/s

Messung von Bauteilen

Widerstände: 100 mOhm bis 20 MOhm
Kapazitäten: 5 pF bis 1 F
Induktivitäten: 1 μ H bis 10 H

Analog-Messungen

AC-Voltmeter: 0 bis 60 V
DC-Voltmeter: 0 bis 60 V
DC Amperemeter: 0 bis 500 mA

DUT-Spannungen

Fest: 5 V, 12 V, -12 V
Variabel: 0 bis 51 V
DC Amperemeter: 0 bis 500 mA

MESSEINRICHTUNGEN, OPTIONAL

Analog-Test

PIN Scan® Technologie: Vektorlose Erkennung offener Lötverbindungen
Kondensatorpolarisierung

Digital-/Funktionstest

1:1 Pin-Architektur, nicht gemultiplext
Umfangreiche Funktions-Test Optionen (eigene Produkte oder/und externe Anbindungen)

MASSE/GEWICHT/AUFBAU/FORM

Auf Anfrage



Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.atecare.de.
Sie erhalten dort ausführliche Informationen zu unseren Produkten, vom einfachen MDA über In-Circuit- und Boundary-Scan-Test bis hin zu 3D SPI-, AOI- und AXI-Technologien.
Wir sind der Partner an Ihrer Seite, wenn es um Test- und Inspektionslösungen geht.
ATEcare vertritt führende Hersteller aus aller Welt

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Markennamen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Abbildungen ähnlich. Ausg. 05/2018

ATEcare Service GmbH & Co. KG
Vertrieb
Kirchbergstraße 21
86551 Aichach
Deutschland

ATEcare Service GmbH & Co. KG
Demo- und Service-Büro
Neufeldstraße 14
85232 Günding
Deutschland

ATEcare Alexander Hörtnert
Vertrieb, Service, Support CH
Friedhofweg 5
9434 Au
Schweiz

Tel. +49 8131 318 575-120
Fax +49 8131 318 575-411
e-Mail info@atecare.com

Tel. +49 8131 318 575-210
Fax +49 8131 318 575-412
e-Mail info@atecare.com

Tel. +41 71 740 10 90
Fax +41 71 740 10 91
e-Mail info@ATEcare.net

Dr. Eschke
Elektronik

www.dr-eschke.de

ATEcare SUPPORT-HOTLINE: +49 8131 318 575-110

www.atecare.de